复合钒钼酸干凝胶薄膜湿敏元件的复阻抗谱

李 $\overline{\mathbf{h}}^1, \mathbf{\hat{\Xi}} \mathbf{\hat{K}}^2, \mathbf{\hat{3}} \mathbf{\mathcal{Z}} \mathbf{\mathcal{L}}^3$

(1、大庆石油学院 化学化工学院,黑龙江 大庆 163318; 2、大庆石油管理局 测井公司,黑龙江 大庆 163412;
 3. 吉林大学 地球探测科学与技术学院,吉林 长春 130026)

摘 要:采用溶胶-凝胶法制备了复合钒钼酸 $H_2V_{12-x}Mo_xO_{31+x}$ · $nH_2O(0 x 4.0)$ 干凝胶薄膜湿敏元件, 对其进行了复阻抗谱分析,结果表明:随着 x的增加,对应的阻抗谱半圆的半径逐渐变大, x 2.5时,电极 表面接触部分在阻抗谱低频端开始体现, x = 2.0时,阻抗值较大,且不受频率影响,元件性能较好;测试频 率为 1 kHz时, $H_2V_{8.5}Mo_{3.5}O_{32}$ · nH_2O 干凝胶薄膜湿敏元件在全湿度范围内,其阻抗-湿度曲线线性良好, 灵敏度较高。

关键词:复合钒钼酸干凝胶薄膜;湿敏元件;复阻抗 中图分类号: TP212.2 文献标识码: A 文章编号: 1000 - 9787(2006)05 - 0039 - 03

Complex impedance plots of poly-vanadium molybdenum acid xerogel thin film hum idity elements^{*}

 $L ILi^{1}$, TONG Mao-song², W ENG A i-hua³

(1. School of Chem istry and Chem iral Engineering, Daqing Petroleum Institute, Daqing 163318, China;

2 Well Logging Company, Daqing Petroleum Administrative Bureau, Daqing 163412, China;

3. College of Geoexploration Science and Technology, Jilin University, Changchun 130026, China)

Abstract Poly-vanadium-molybdenum acid $H_2V_{12-x}Mo_xO_{31-xy} \cdot nH_2O(0 x 4 0)$ xerogel thin films humidity elements are prepared by sol-gel process, and its complex impedance plots are analyzed Results show that the radius of semicircle of the complex impedance plots for poly-vanadium-molybdenum acid xerogel thin films increase with increasing of x When x 2 5, in the low-frequency range, the contact part of the total impedance for electrode appears The properties of humidity elements are best as x = 2 0, while the complex impedance is higher and no relationship with frequency $H_2V_{8.5}Mo_{3.5}O_{32} \cdot nH_2O$ xerogel thin film humidity element has good linear and high sensitivity in total relative humidity range at 1 kHz

Key words: poly-vanadium-molybdenum xerogel thin film; humidity element; complex impedance

0 引 言

以 V₂O₅为基体的复合钒酸类干凝胶薄膜为层状结构,层状结构的主体为 V-O 网络,层间为结合水,其中,部 分 V可被 Mo, Cr, Ti等过渡金属替代,是一种新型的湿敏 材料^[1~3],目前,对其湿敏特性研究的较少,对其感湿机理 的研究未见报导,而复阻抗谱分析是研究湿敏材料感湿机 理的有力手段。

本文采用溶胶-凝胶方法制备了复合钒钼酸干凝胶薄 膜湿敏元件,首次研究了 Mo取代 V的量及频率对其复阻 抗的影响。

1 实验

1.1 复合钒钼酸凝胶的制备
 利用溶胶-凝胶法制备复合钒钼酸凝胶,在0下,将

一定比例的 V_2O_5 和 Mo粉溶于 H_2O_2 中,不断搅拌,得到深 绿色无沉淀的前驱溶胶,100 下,干燥失水后,得到复合 钒钼酸 $H_2V_{12-x}Mo_xO_{31+xy} \cdot nH_2O(0 x 4 0)凝胶, x为每$ 个钒钼酸分子中取代 V的 Mo原子个数, y为 Mo取代 V后 变化的氧原子数)。

1.2 湿敏元件制作及复阻抗测试

采用旋涂法将凝胶涂覆于带有梳状电极的陶瓷衬底 上,自然环境下干燥即得到复合钒钼酸干凝胶薄膜湿敏元 件,如图 1所示。

利用 HP4194A型阻抗分析仪测量样品在不同湿度下 的复阻抗,测试夹具为 Agilent 16085B,测试电压为 1V,测 试温度为 20 ,湿度范围为 11% ~97% RH,湿度由饱和盐 提供。HP4194A型阻抗分析仪能够在 100 Hz~40MHz频

收稿日期: 2005 - 11 - 09

*基金项目:国家自然科学基金资助项目(40304009)

率范围内按照对数平均扫频测量 401个点,即测量 401个 频率,由于每一次实验的测量点数为 401点,数据量庞大, 人工记录非常困难,因此,在本文中采用 Agilent 82350A GPB卡将 HP4194A 阻抗分析仪与计算机相连,编制了相 应的设备驱动与数据采集程序,实现湿敏元件的复阻抗谱 全自动测量。



图 1 湿敏元件示意图



- 2 结果与讨论
- 2.1 H₂V_{12-x}Mo_xO_{31 ±y} · nH₂O中 x值对复阻抗的影响 实验中,测试了相同湿度下 (75 % RH)不同 x值的 H₂V_{12-x}Mo_xO_{31 ±y} · nH₂O (x = 0, 0 5, 1. 0, 1. 5, 2 0, 2 5, 3 0, 3. 5, 4. 0) 干凝胶薄膜湿敏元件的复阻抗谱,如图 2,图 3。











Fig 3 Complex in pedance plots for $H_2V_{12. x}Mo_xO_{31 \pm y} \cdot nH_2O$ (2.5 x 4.0) xerogel thin film hum id ity elements

从图 2、图 3可以看出:当 x 2 0时,湿敏元件的复阻

抗谱近似半圆,阻抗与频率无关,随着 x的增加,半圆的半 径逐渐变大, x = 2 0时,不同 x值的干凝胶薄膜湿敏元件 的特征频率 $\{f_c = 1/(2 R_f C_f)\}$ 列于表 1;当 2 5 x = 4.0时,半圆的半径继续变大,但低频端出现如下变化:随着 x增加,低频端从向外翘出到变成一段圆弧,最后,成为上翘 的线段,阻抗与频率有关。

表 1 不同 M o含量的 H₂V_{12 · x}M o_xO_{31 ±y} · nH₂O(0 x 2.0) 干凝胶薄膜湿敏元件的特征频率

Tab 1 Characteristic frequency for $H_2 V_{12 - x} M o_x O_{31 \pm y} + n H_2 O$

(0	x 2.0) xerogel thin film hum id ity elements	
	$H_2 V_{12 - x} Mo_x O_{31 \pm y} \cdot n H_2 O$	特征频率
	干凝胶中的 x值	(kH z)
	0	349. 383
	0. 5	42. 950
	1.0	27. 346
	1. 5	19. 808
	2.0	11. 448

由表 1可以看出:0 x 2 0,特征频率向低频方向移 动。Mickevicius等人^[4]认为复合钒钼酸干凝胶中 V^{4+} 的浓 度随着 x的增加而降低 ,而 V^{4+} 和 V^{5+} 之间的电子跃迁决 定凝胶的电子电导,因此, x增加使 V^{4+} 减少,导致薄膜电 阻增大。Volkov等人研究认为,复合钒钼酸干凝胶薄膜的 层间距随着 *x*的增加而增大^[1],层间距增大使层间吸附水 增多,增加了材料的有效介电常数,使薄膜电容增大。所 以,随着 x增加,薄膜电阻和薄膜电容都增大,导致半圆的 半径逐渐变大,特征频率向低频方向移动;25 x 4.0 时,如上所述,薄膜电阻和薄膜电容随着 x的增大继续增 大,高频端对应的圆弧半径也继续变大;其低频端对应的等 效电路可用电极表面接触电阻和电极表面接触电容的并联 表示,低频端出现的变化可能是由于 x增大导致层间距增 大,吸附水增多,电离的 H⁺和 OH⁻在电极表面的积累增 多,空间电荷极化加强;当 x = 25和 x = 30时,极化作用 开始体现,使低频端开始向外翘出; x = 3.5时,极化作用进 一步加强,电极表面电容和电极表面电阻共同作用使低频 端出现圆弧; x = 4.0时,极化作用最强,电极表面电容达到 最大,电极表面电阻的作用可以忽略,主要体现电容的作 用,使小圆弧变成线段。

综上分析,可以看出:x越大,复阻抗值越大,以复阻抗 为感湿特征量的湿敏元件的灵敏度应越高,但当 x > 2 0 时,有频率因素影响,而且,x超过 2 0后,凝胶稳定性变差, 易于沉淀,同时,考虑湿滞回差等因素,当以复阻抗为感湿特 征量时,x = 2 0时,相应的凝胶薄膜湿敏元件性能较好。

当 x > 2 0时,频率对复阻抗有影响,实验中,以 x = 3.5的 $H_2V_{8.5}Mo_{3.5}O_{32} \cdot nH_2O$ 干凝胶薄膜湿敏元件为例讨论

频率对其复阻抗的影响。

2.2 频率对干凝胶薄膜湿敏元件复阻抗的影响

从图 4可以看出:频率对湿敏元件的阻抗特性有很大 影响,频率增加,阻抗降低,随着湿度增加,阻抗降低的幅度 变小;当频率小于 10 kHz时,同一频率下,在全湿范围内, 阻抗随湿度的增加而线性降低,其中,频率为 1 kHz时线性 最好,灵敏度 (即曲线的斜率)较高;当测试频率超过 10 kHz 时,阻抗随湿度的变化不大,无湿敏特性。



图 4 H₂ V_{8 5}M o_{3 5}O₃₂ · nH₂O 干凝胶薄膜湿敏元件的阻抗与 相对湿度特性曲线

Fig 4 Characteristic curves of inpedance vs relative hum idity for $H_2 V_{8.5} M o_{3.5} O_{32} \cdot n H_2 O$ xerogel thin film hum idity elements 3 结 论

(1)通过利用溶胶-凝胶方法制备出了复合钒钼酸
 H₂V_{12-x}Mo_xO_{31 ±y} ・ nH₂O(0 x 4 0)干凝胶薄膜,并对其
 进行了复阻抗分析,当x 2 0,湿敏元件的复阻抗谱近似

(上接第 38页)

2 920 2 V, 80 时,输出电压为 2 881 6 V,即从 0~80 ,输 出电压漂移为 - 1.32 %,而 JJG 644 - 90标准最大温度漂 移允许变化 12 1 %,证明了补偿方法的有效性。



and without feedback compensation

半圆,阻抗与频率无关,随着 x的增加,半圆的半径逐渐变 大,特征频率向低频方向移动;当 2 5 x 4 0时,高频端 半圆的半径继续变大,低频端电极表面接触部分有所体 现,阻抗与频率有关;

(2)综合考虑频率、湿滞、凝胶稳定性等因素,当 x =
 2 0时, H₂V_{12-x}Mo_xO_{31 ±y} · nH₂O干凝胶薄膜湿敏元件的性
 能较好;

(3)工作频率为 1 kHz时, H₂V_{8 5}Mo_{3 5}O₃₂ · *n*H₂O干凝 胶薄膜湿敏元件在全湿度范围内,元件的阻抗-湿度关系曲 线线性良好,灵敏度较高。

参考文献:

- Bondarenka V, Grebinskij S, Mickevičius S, et al Thin films of poly-vanadium-molybdenum acid as starting materials for humidity sensors[J]. Sensors and Actuators B, 1995, 28: 227 - 231.
- [2] Bondarenka V, Grebinskij S, Mickevičius S, et al Humidity sensors based on H₂V₁₁ TO_{30 3} • nH₂O xerogels [J]. Sensors and Actuators B, 1999, 55: 60 - 64.
- [3] 童茂松,戴国瑞,阎 伟,等.复合钒钼酸凝胶薄膜的湿敏特
 性研究[J].仪器仪表学报,2001,22(1):45-47.
- [4] Mickevičius S, Bondarenka V, Grebinskij S, et al Humidity sensing propertied of V₂O₅ based xerogels [A]. Proceedings of the Sensors Workshop [C]. The Netherlands: Veldhoven, 2000. 665 - 668.

作者简介:

李 莉 (1972 -),女,吉林省长春人,硕士,主要从事纳米功能 材料的研究。

4 结束语

为了解决电涡流间隙传感器的温度漂移问题,通过建 立检测线圈阻抗随温度变化的数学模型,对电阻引起的温 度漂移进行了补偿,通过温升试验的对比,验证了数学模型 的正确性;增加与检波电路参数相同的补偿电路,采用差分 方式将检波电路环节引起的温度漂移抵消。

参考文献:

- [1] 方秋华,茅 佩,田新启,等.电涡流传感器温度漂移的自动
 补偿[J].仪器仪表学报,1997,18(2):198-201.
- [2] 王琴妹,潘再平.电涡流传感器线圈充磁介质对抑制温漂及 测量性能的影响[J].科技通报,2002,18(4):295-298.

[3] 刘 颖. 圆柱函数 [M]. 北京:国防工业出版社, 1983. 3. 作者简介:

吕梁(1980-),男,辽宁辽中人,硕士研究生,主要从事于高 速磁悬浮列车悬浮控制系统的间隙检测技术的研究。